

Sommaire

1. **Préambule**
2. **Définition**
3. **Choix des méthodes à utiliser et fréquence**
4. **Méthodes**
 - 4.1 Suivi d'un objet connu
 - 4.2 Redondance des mesures
 - 4.3 Processus de mesure dédié
 - 4.4 Corrélation/Caractère intrinsèque des caractéristiques « objet »
 - 4.5 Cas de l'utilisation d'objet Conforme et Non-conforme
5. **Conclusion**
6. **Annexes**
 - 6.1 Annexe I – Position et dispersion
 - 6.2 Annexe II – L'écart normalisé
 - 6.3 Annexe III – Les cartes aux « écarts normalisés »
 - 6.4 Annexe IV – La carte EWMA
 - 6.5 Annexe V – Les tests de Mandel
 - 6.6 Annexe VI – Le test de Von Neumann